

# **СОДЕРЖАНИЕ**

## **Материалы электронной техники**

- Троянчук И.О., Карпинский Д.В., Силибин М.В., Неклюдов К.Н., Гаврилов С.А.* Влияние сверхобменных взаимодействий на ферромагнитные свойства манганитов и кобальтитов..... 106

- Рощин В.М., Петухов И.Н., Сеньченко К.С., Роцина А.В., Шилина Т.В.* Формирование двухкомпонентных вертикальных контактных структур для монтажа кристаллов интегральных схем ..... 116

## **Технология микро- и наноэлектроники**

- Яфаров Р.К., Горнев Е.С., Орлов С.Н., Тимошенков С.П., Тимошенков В.П., Тимошенков А.С.* Формирование автоэмиссионных эмиттеров с использованием микроволнового плазмохимического синтеза наноуглеродных структур ..... 122

## **Микроэлектронные приборы и системы**

- Плюснин Н.И.* Спиновые инжекторы и транзисторы для кремниевой спINTRоники. Обзор..... 128

- Чаплыгин Ю.А., Крупкина Т.Ю., Красюков А.Ю., Артамонова Е.А.* Приборно-технологическое моделирование элементов интегральной электроники с повышенной стойкостью к внешним воздействиям..... 139

- Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Балака Е.С.* Анализ устойчивости КМОП дифференциальных усилителей к воздействию накопленной дозы ионизирующих излучений..... 145

<b>Нанотехнология</b>		
<i>Авдеева А.В., Цзан С., Мурадова А.Г., Юртов Е.В.</i>		
Формирование наностержней оксида цинка методом осаждения .....	152	
<b>Схемотехника и проектирование</b>		
<i>Меликян В.Ш., Галстян В.А.</i>	Интегральный понижающий преобразователь входного напряжения с цифровым контролем обратной связи и коэффициента преобразования.....	158
<b>Информационные технологии</b>		
<i>Минаков Е.И., Мацур И.Ю.</i>	Информационно-измерительная система управления дорожно-транспортной обстановкой на основе радиочастотной идентификации .....	167
<i>Поперечный П.С., Беляев А.А., Колесникова И.Ю.</i>	Верификация аппаратных описаний алгебраических блоков в среде MatLab .....	173
<b>Интегральные радиоэлектронные устройства</b>		
<i>Переверзев А.Л., Якунин А.Н., Янин В.И.</i>	Построение миниатюрных бортовых информационно-управляющих систем и аппаратно-программных комплексов для их тестирования.....	179
<b>Методы и техника измерений</b>		
<i>Усапов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В., Пономарев Д.В., Латышева Е.В.</i>	Измерения электрофизических характеристик полупроводниковых структур с использованием СВЧ фотонных кристаллов.....	187
8 февраля – День российской науки. Миэтовские научные чтения .....	2 стр. обложки	